

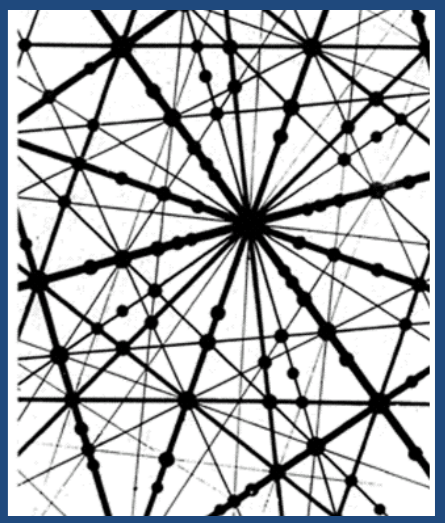
Моделирование тепловых процессов, возникающих в материалах под действием лазерных импульсов в рамках гиперболической модели термического пика



И.В. Амирханов, И. Сархадов, З. К. Тухлиев

¹Лаборатория информационных технологий, Объединенный Институт Ядерных Исследований, ул. Жолио-Кюри 6, Дубна, Московская область, Россия, 141980

*E-mail: ibrohim@jinr.ru



Аннотация

Одной из широко принимаемых моделей для описания процессов, протекающих при взаимодействии заряженных частиц с материалами, является модели термического пика (МТП), базирующаяся на системе двух связанных уравнений теплопроводностей для электронного газа и кристаллической решетки (система параболических уравнений). В работе предложена модификация МТП, базирующаяся на системе двух связанных гиперболических уравнений теплопроводности. Действие лазера в электронном газе, учтено через функцию источника, которую выбрали в виде двойного фемтосекундного лазерного импульса. В гиперболическом уравнении в отличие от параболического, присутствуют дополнительные параметры, которые характеризуют времена релаксации потока тепла в электронном газе и кристаллической решетки. Кроме этого, в источнике гиперболического уравнения присутствуют дополнительные слагаемые – производные от плотности мощности источника параболического уравнения и от разности температур электронного газа и кристаллической решетки. Это означает, что на температуру образца оказывает влияние не только плотность мощности источника, но и скорости его изменения. Кроме этого, на температуру образца также влияет скорости изменения разности температур электронного газа и кристаллической решетки. Проведено численное исследование решений параболического и гиперболического уравнений модели термического пика при одинаковых физических параметрах и проведен сравнительный анализ полученных результатов.

Введение

Исследование взаимодействия фемтосекундных лазерных импульсов с веществом является важным в связи с многими фундаментальными проблемами (физика неравновесных процессов, генерация ударных волн, лазерное ускорение ионов, модификация свойств облучаемого материала и т.д.) [1-3].

В настоящее время, возрастает необходимость в создании и совершенствовании достоверных физических моделей, способных описывать различные процессы в веществе. При этом компьютерное моделирование занимает сейчас одно из главных мест в исследовании таких задач. Существуют два подхода исследования и создания физических моделей – атомистический и континуальный.

Атомистические подходы (метод молекулярной динамики), которые позволяют естественным образом учитывать атомарную структуру кристаллической решетки, влияние примесей, наличие дислокаций, кинетику фазовых переходов и т.д. Континуальный подход (решение уравнений механики сплошных сред) – это параболическое и гиперболическое уравнения теплопроводности, двухтемпературная модель теплопроводности, двухтемпературная гидродинамическая модель и т.д. [2].

Для описания динамики быстропротекающих процессов, возникающих в веществе под воздействием лазерного импульса можно использовать метод молекулярной динамики (МД) [4]. МД довольно эффективна для микроскопического анализа механизмов плавления и испарения [5,6]. Возникновение и распространение волн давления, сгенерированных лазерным излучением [7,8], а также динамики лазерной абляции [9] хорошо моделируются с помощью МД.

В работе проведено численное исследование физических процессов, возникающих при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов в рамках параболического и гиперболического уравнений теплопроводности (МТП) и проведен сравнительный анализ полученных результатов.

Постановка задачи

При моделировании тепловых процессов, возникающих в материалах под воздействием фемтосекундных лазерных импульсов, следуя работе [1], модифицируем МТП:

$$C_e \frac{\partial T_e}{\partial t} = -\frac{\partial q_e}{\partial x} - \gamma(T_e - T_i) + A_e(x, t); \quad q_e + \tau_e \frac{\partial q_e}{\partial t} = -\lambda_e \frac{\partial T_e}{\partial x} \quad (1)$$

$$C_i \frac{\partial T_i}{\partial t} = -\frac{\partial q_i}{\partial x} + \gamma(T_e - T_i) + A_i(x, t); \quad q_i + \tau_i \frac{\partial q_i}{\partial t} = -\lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial x} \quad (2)$$

Здесь T_e, T_i – температурные поля электронного газа и кристаллической решетки облучаемого образца, $C_e, C_i, \lambda_e, \lambda_i$ – соответственно удельные теплоемкости и коэффициенты теплопроводности электронного газа и кристаллической решетки, γ – коэффициент электрон-фононного взаимодействия электронной подсистемы с решеткой; $A(x, t)$ – функция источника, которая определяет плотность мощности тепловыделения в точке с координатой x в момент времени t , τ_e, τ_i – характерные времена релаксации потоков энергии в электронном газе и кристаллической решетки.

При $\tau_e = \tau_i = 0$ данная модель переходит в МТП. Полагая теплоемкости и теплопроводности электронного газа и кристаллической решетки не зависящими от температуры, т.е. как константы, после исключения потоков искома система уравнений (1)-(2) принимает следующий вид:

$$C_e \left(\frac{\partial T_e}{\partial t} + \tau_e \frac{\partial^2 T_e}{\partial t^2} \right) = \lambda_e \frac{\partial^2 T_e}{\partial x^2} - \gamma(T_e - T_i) - \gamma \tau_e \frac{\partial}{\partial t} (T_e - T_i) + A_e(x, t) + \tau_e \frac{\partial A_e(x, t)}{\partial t} \quad (3)$$

$$C_i \left(\frac{\partial T_i}{\partial t} + \tau_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial t^2} \right) = \lambda_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \gamma(T_e - T_i) + \gamma \tau_i \frac{\partial}{\partial t} (T_e - T_i) + A_i(x, t) + \tau_i \frac{\partial A_i(x, t)}{\partial t} \quad (4)$$

Слагаемые $\tau_e \frac{\partial A_e(x, t)}{\partial t}, \gamma \tau_e \frac{\partial}{\partial t} (T_e - T_i), \alpha = e, i$ означают, что на температурные поля оказывают влияние не только источники, но и влияют скорость изменения источника и скорость обмена энергией электрон-фононного взаимодействия электронной подсистемы с решеткой.

Уравнение (3)-(4) решим со следующими начальными и граничными условиями:

$$T_\alpha(x, 0) = T_0; \quad \left. \frac{\partial T_\alpha(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0; \quad \left. \frac{\partial T_\alpha(x, t)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0; \quad T_\alpha(x_{max}, t) = T_0, \quad \alpha = e, i. \quad (5)$$

Функции источника выбираем в факторизованном виде:

$$A_\alpha(x, t) = I_0 [1 - R(T_s)] f_1(x) f_2(t) p_\alpha, \quad \alpha = e, i; \quad T_s = T_i(0, t), \quad p_i = 1 - p_e.$$

Здесь $f_1(x), f_2(t)$ – соответственно пространственная и временная формы источника, I_0 – интенсивность источника, $R(T_s)$ – коэффициент отражения лазерного импульса от поверхности материала, p_e, p_i – соответственно доли потери энергии лазера в электронном газе и кристаллической решетке.

В данной работе функции $f_1(x)$ и $f_2(t)$ выбраны как в работе [1]:

$$f_1(x) = \frac{\exp(-x/L_p)}{L_p}, \quad f_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\exp \left[-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma_t^2} \right] + \exp \left[-\frac{(t-t_0-\tau_d)^2}{2\sigma_t^2} \right] \right).$$

Здесь L_p – глубина проникновения лазера в вещество, t_0 – момент времени, когда первый импульс источника принимает максимальное значение, τ_d – сдвиг по времени второго импульса источника по отношению первого импульса. Доза излучения $\Phi = I_0 \int_0^\infty f_2(t) dt = 2I_0\sigma_t$.

Численный эксперимент и обсуждение его результатов

Численный эксперимент проведен для материала никеля, облучаемого лазером двойного импульса со следующими параметрами:

$$\lambda_i = 91 \frac{\text{Вт}}{\text{КМ}}, \quad \rho_i = 4560 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad c_i = 500 \frac{\text{Дж}}{\text{кгК}}, \quad x_{max} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ м}, \quad T_0 = 300 \text{ К},$$

$$R(T_s) = 0, \quad C_i = \rho_i c_i = 2,28 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{КМ}^3}, \quad \lambda_e = 200 \frac{\text{Вт}}{\text{КМ}}, \quad C_e = 27330 \frac{\text{Дж}}{\text{КМ}^3}, \quad L_p = 3 \cdot 10^{-8} \text{ м}$$

$$\gamma = 2,733 \cdot 10^{18} \frac{\text{Дж}}{\text{КМ}^3}, \quad \Phi = 4 \cdot 10^4 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}, \quad \sigma_t = 5 \cdot 10^{-16} \text{ с}, \quad t_0 = 3 \cdot 10^{-15} \text{ с}, \quad \Delta x = 3 \cdot 10^{-8} \text{ м},$$

$$\Delta t = 10^{-14} \text{ с}, \quad \tau_d = 4 \cdot 10^{-15} \text{ с}, \quad \tau_e = 10^{-14} \text{ с}, \quad \tau_i = 10^{-12} \text{ с}, \quad p_i = 0.$$

При этих параметрах безразмерные константы $k_e, k_i, \gamma_e, \gamma_i, A_{0e}, A_{0i}, \beta, \bar{\tau}_e, \bar{\tau}_i$ принимают значения: $k_e \approx 4,437 \cdot 10^{-4}; k_i \approx 8,13 \cdot 10^{-2}; \gamma_e = 1; \gamma_i \approx 1,199 \cdot 10^{-2}; A_{0e} \approx 1626214,579; A_{0i} \approx 19493,1774; \beta = 1; \bar{\tau}_e = 1; \bar{\tau}_i = 100$.

На рис. 1-3 приведены численные результаты для температур электронного газа и кристаллической решетки в рамках МТП, и для температуры кристаллической решетки в рамках уравнения теплопроводности.

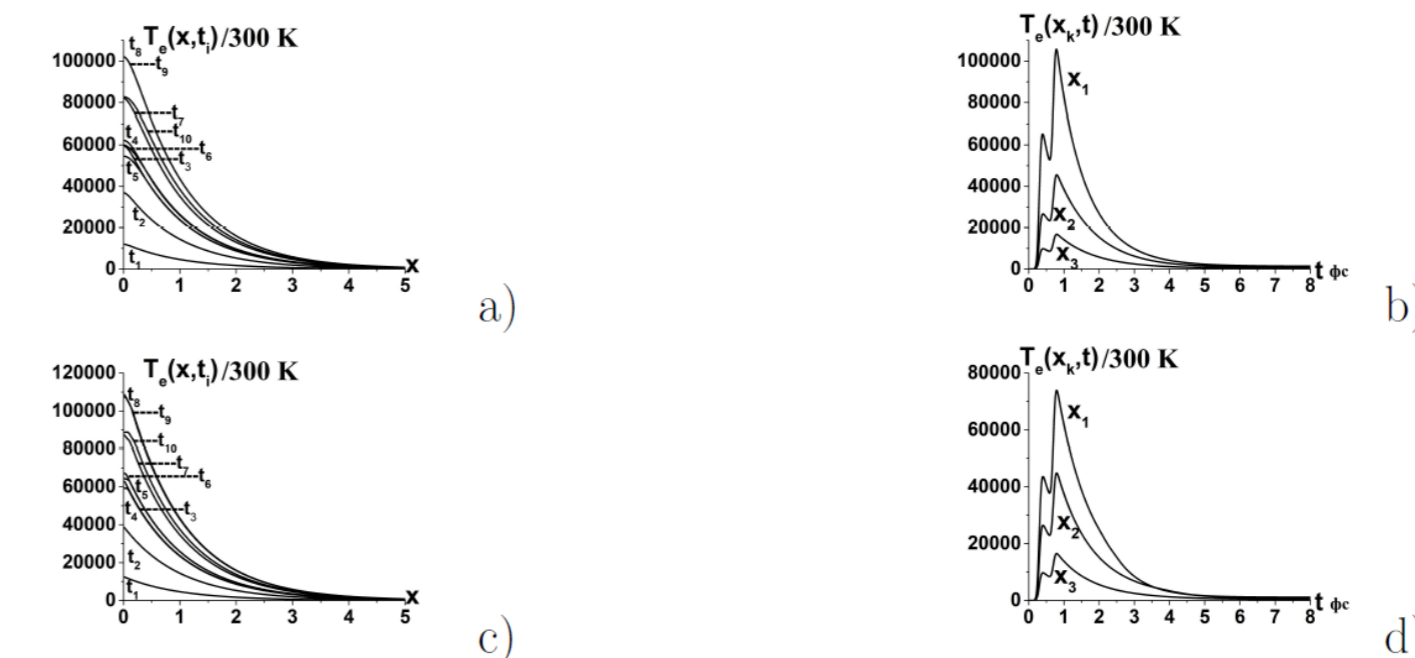


Рис.1. Профили температуры электронного газа в разных моментах времени $T_e(x, t_j), j = 1, 2, \dots, 10, t_1 = 2,5 \text{ фс}, t_2 = 3 \text{ фс}, t_3 = 3,5 \text{ фс}, t_4 = 4,5 \text{ фс}, t_5 = 5,5 \text{ фс}, t_6 = 6,5 \text{ фс}, t_7 = 7 \text{ фс}, t_8 = 7,5 \text{ фс}, t_9 = 8,5 \text{ фс}, t_{10} = 10 \text{ фс}$, и динамика искомых температур на разных глубинах образца ($T_e(x_k, t), k=1,2,3, x_1 = 1,5 \text{ нм}, x_2 = 3 \text{ нм}, x_3 = 6 \text{ нм}$), полученные в рамках МТП (a,b) и гиперболической МТП (c,d)

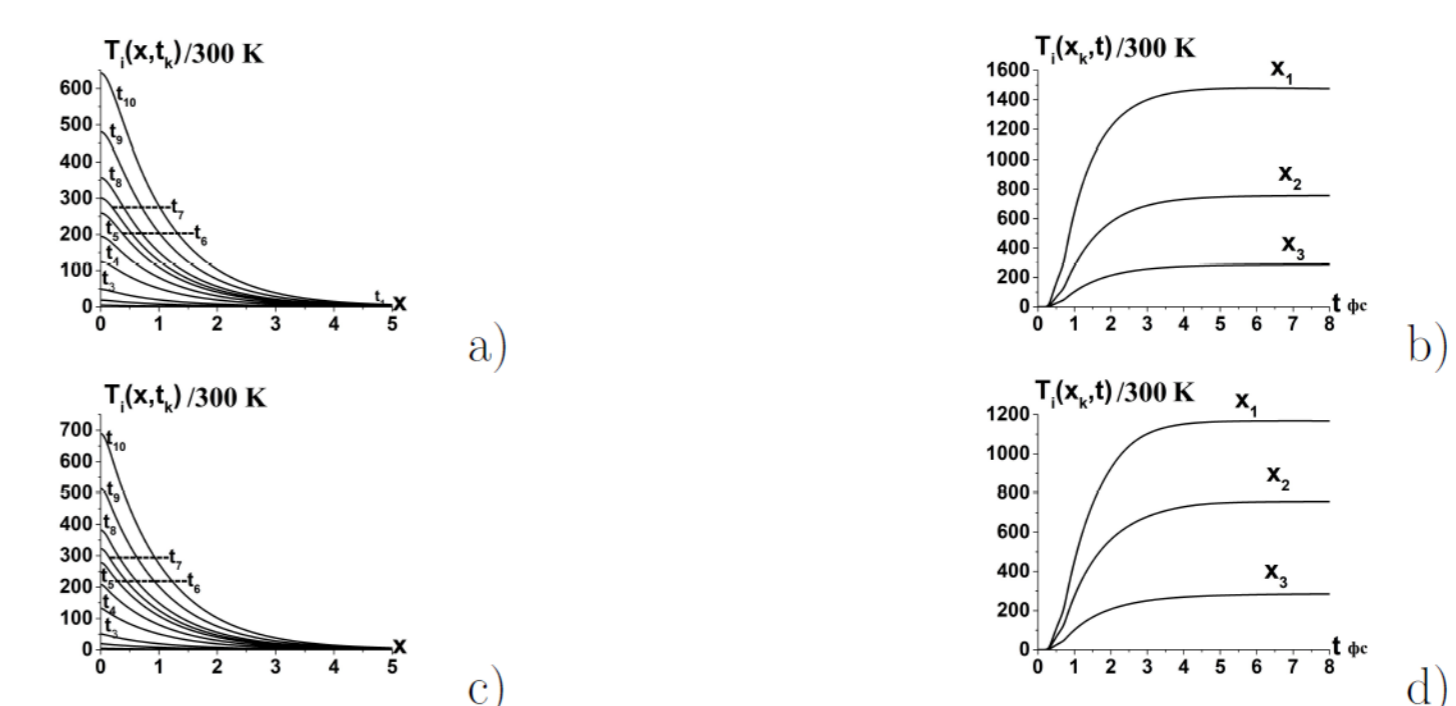


Рис.2. Профили температуры кристаллической решетки в разных моментах времени $T_i(x, t_j), j = 1, 2, \dots, 10, t_1 = 2,5 \text{ фс}, t_2 = 3 \text{ фс}, t_3 = 3,5 \text{ фс}, t_4 = 4,5 \text{ фс}, t_5 = 5,5 \text{ фс}, t_6 = 6,5 \text{ фс}, t_7 = 7 \text{ фс}, t_8 = 7,5 \text{ фс}, t_9 = 8,5 \text{ фс}, t_{10} = 10 \text{ фс}$, и динамика искомых температур на разных глубинах образца ($T_i(x_k, t), k=1,2,3, x_1 = 1,5 \text{ нм}, x_2 = 3 \text{ нм}, x_3 = 6 \text{ нм}$), полученные в рамках МТП (a,b) и гиперболической МТП (c,d)

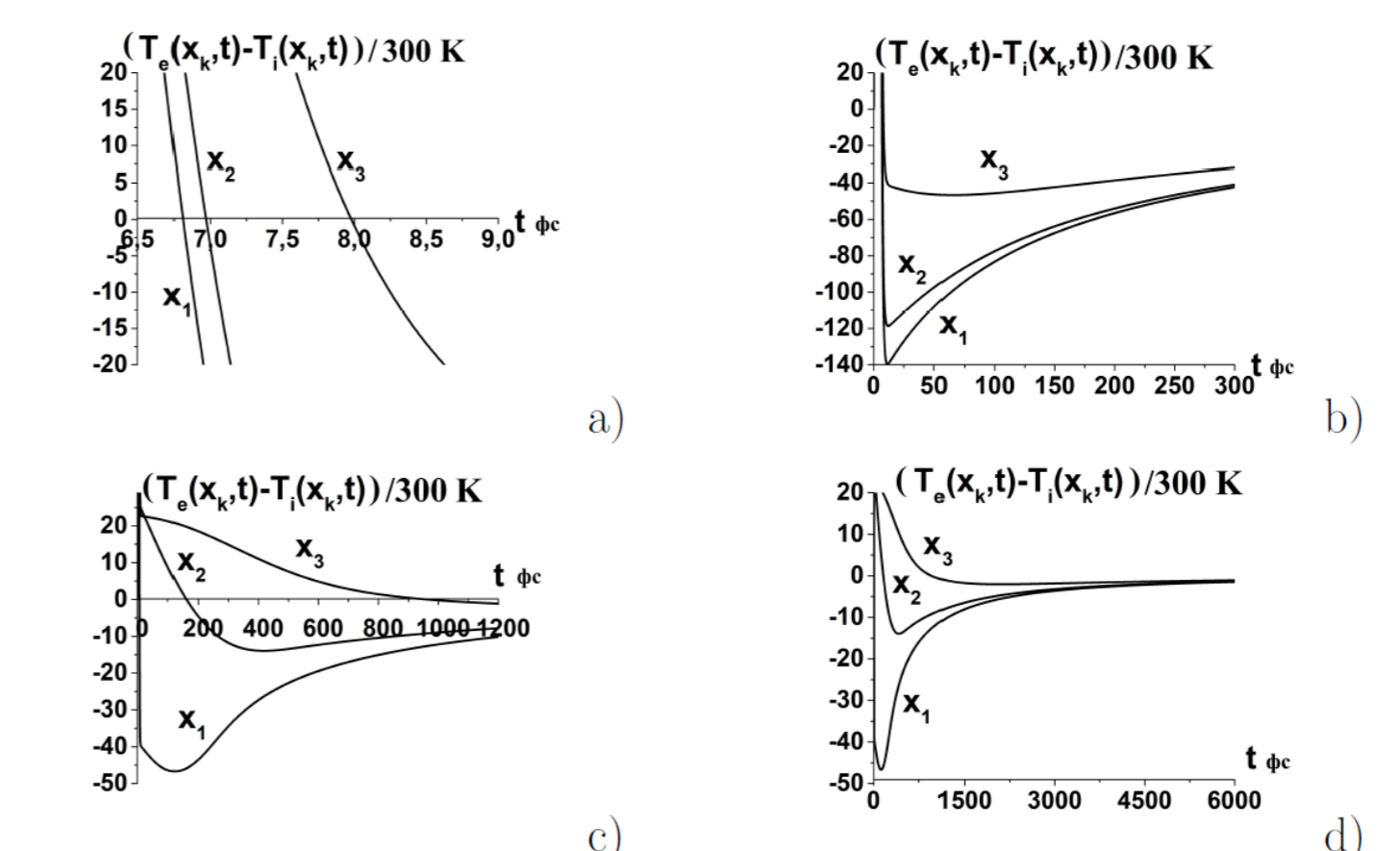


Рис.3. Динамика разности температур электронного газа и кристаллической решетки на разных глубинах образца ($T_e(x_k, t) - T_i(x_k, t), k=1,2,3, x_1 = 0,3 \text{ нм}, x_2 = 0,6 \text{ нм}, x_3 = 1,5 \text{ нм}$), полученной в рамках МТП (a,b) и гиперболической МТП (c,d).

Заключение

В обеих моделях температура электронного газа вблизи поверхности образца в начале превышает температуру кристаллической решетки, но наступает момент времени, когда температура кристаллической решетки будет превышать температуру электронного газа, а потом эта разность стремиться к нулю, т.е. обе температуры стремятся к начальной температуре образца. Поведения профилей температуры электронного газа и кристаллической решетки и их динамики на разных глубинах в обеих моделях сильно отличаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта № 20-51-44001.

Литература

1. Анисимов С.И., Лукьянчук Б.С. Избранные задачи теории лазерной абляции. УФН, 2002г., т. 172, №3, стр. 301-333.
2. Вейко В.П., Либенсон М.Н. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Силовая оптика. /Под ре. В.И. Конова. -- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. --312с. -- ISBN 978-5-9221-0934-5.
3. И. Сархадов, И.В. Амирханов, Н.Р. Саркер Численное моделирование тепловых процессов, возникающих в материалах при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов в рамках гиперболической модели термического пика./Труды XI Всероссийской конференций ИТТММ-2021, Москва, РУДН, 19-23 апреля.